

GB/T 7141高温老化试验后 拉伸机械性能比对试验

产品名称	GB/T 7141高温老化试验后 拉伸机械性能比对试验
公司名称	深圳市华瑞测科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:华瑞测 型号:DW14 周期:3-7天
公司地址	中国深圳龙岗区横岗街道富利时路3号
联系电话	0755-23093158 13684912512

产品详情

GB/T 7141高温老化试验后 拉伸机械性能比对试验

高低温老化测试。那么，电子产品为什么要进行高低温老化测试呢？我相信这个问题很多人都有想过，高低温老化。

随着电子技术的发展，电子产品的集成化程度越来越高，结构越来越细微，工序越来越多，制造工艺越来越复杂，这样在制造过程中会产生一些潜伏缺陷。电子产品在生产制造时,因设计不合理、原材料或工艺措施方面的原因引起产品的质量问题的概括有两类：

第一类是产品的性能参数不达标，生产的产品不符合使用要求；第二类是潜在的缺陷，这类缺陷不能用一般的测试手段发现，而需要在使用过程中逐渐地被暴露，如硅片表面污染、组织不稳定、焊接空洞、芯片和管壳热阻匹配不良等等。

一般这种缺陷需要在元器件工作于额定功率和正常工作温度下运行一千个小时左右才能全部被激活(暴露)。显然，对每只元器件测试一千个小时是不现实的，所以需要对其施加热应力和偏压，例如进行高温功率应力试验，来加速这类缺陷的提早暴露。也就是给电子产品施加热的、电的、机械的或多种综合的外部应力，模拟严酷工作环境，消除加工应力和残余溶剂等物质，使潜伏故障提前出现，尽快使产品通过失效浴盆特性初期阶段，进入高可靠的稳定期。

通过高温老化可以使元器件的缺陷、焊接和装配等生产过程中存在的隐患提前暴露，老化后再进行电气参数测量，筛选剔除失效或变值的元器件，尽可能把产品的早期失效消灭在正常使用之用，从而保证出厂的产品能经得起时间的考验。

华瑞测分析专业提供电子产品高低温老化、高低温试验、恒温恒湿试验、高低温冲击试验、紫外光老化试验等各种电子产品环境试验，通过多年的不断努力与客户的支持与信赖，已经应用于：航空、航天、军事、IT、通讯、电器、汽车、化工、塑胶、橡胶、塑料、金属、建筑、电线电缆、皮革、纺织、医药、机械、箱包、印刷及其高等院校等各大领域。技术、品质、服务快捷到位，如有需求，敬请与我们

通电，期待您的来电！